**Смирнова Вера Петровна. Исследование и разработка методов оценки сечения сбоя и повышения стойкости интегральных запоминающих устройств к воздействию тяжелых заряженных частиц;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»], 2023**